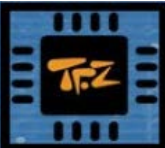


科技部計畫

針對內建人工智慧之車用晶片且以
【零故障】為目標之智慧型測試方法(TfZ)
會議記錄

2020/12/25



會議資訊

- 時間 – 2020/12/25 09:00 ~
- 地點 – Skype線上會議(清華大學 台達館 923)
- 與會成員 – 清華大學
 - 黃錫瑜 教授
 - 許竹均 DRI / 會議記錄
 - 蔡承霖 Workshop 聯繫人
 - 楊竣宇 Website聯繫人
 - 楊舜華 碩士生
 - 林昂德 碩士生
 - 劉霖 碩士生
- 交通大學
 - 溫宏斌 教授
 - 林禹文 DRI
 - 梁家為 博士生
 - 湯忠禮 碩士生
- 中山大學
 - 李淑敏 教授
 - 李建德 DRI
- 彰師大
 - 黃宗柱 教授
 - 黃靖 DRI

議程

- 一般行政事項討論
 - 計畫網頁說明
 - workshop 籌備事宜
- Tfz計畫討論
 - 小組技術分享(中山/中興大學)
 - 未來成果展示之規劃
- 臨時動議與下次月會時間討論

一般行政事項討論-計畫網頁說明

■ 聯繫人 清大 楊竣宇 碩士生

■ (無)

Tfz計畫討論-技術分享與討論(彰化師範大學)

- 主題:
- **PWS: Potential WafermapScratch Defect Pattern Recognition with Machine Learning Techniques**
- 講者 中山/中興大學 江勛豪 同學
- (內容請參閱上傳至網頁的附件)

下次月會綱要

- 舉行時間 2021/01/22
- 舉行方式 線上skype
- 會議通知與議程 清大 許竹均 將會事先發送給參與人員
- 技術分享主持 交通大學
- 技術分享學校 交通大學/清華大學/中山大學/彰師大
- 報告投影片將事先放在資料庫中分享(清大 許竹均 負責)



Thank You for Your Participation